

# 集成电路-内部目视检查(混合电路)-百检网

产品名称	集成电路-内部目视检查(混合电路)-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网，不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构，促进产品质量提升，还能还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单，轻松实现互联网营销。

1 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.4 X射线照相

2 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3c) 两个或三个引出端之间电测试

3 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 b) 外壳绝缘

4 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.1 外部检查

5 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.4 e) 扫描电子显微技术和电子束显微分析

6 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 a) 阈值试验

7 《半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分:高温贮存》 IEC 60749-6 : 2002 高温贮存

8 《半导体器件 机械和气候试验方法 第9部分:标准耐久性》 IEC 60749-9 : 2002 标志耐久性

9 《半导体器件 机械和气候试验方法 第5部分:稳态温湿度偏置寿命验》 IEC 60749-5 : 2003 稳态温湿度偏置寿命验

10 《半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分:机械冲击》 IEC 60749-10 : 2002 机械冲击

11 《半导体器件 机械和气候试验方法 第36部分:恒定加速度》 IEC 60749-36 : 2003 恒定加速度

12 《半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分:盐气》 IEC 60749-13 : 2002 盐气

13 《半导体器件 机械和气候试验方法 第8部分:密封》 IEC 60749-8 : 2002 密封

14 《半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分:可焊性》 IEC 60749-21 : 2004 可焊性

15 《半导体器件 机械和气候试验方法 第22部分:键合强度》 IEC 60749-22 : 2002 键合强度